

Kurzbeschreibung

Bei der Messdienstleistung ICEM Scan wird ein Prüfverfahren nach Norm IEC/TS 61967-3 angewendet. Bei diesem Prüfverfahren werden die elektrischen oder magnetischen Nahfeldkomponenten auf oder nahe der Oberfläche eines IC gemessen. Dieses Diagnoseverfahren dient der Architekturanalyse eines IC wie beispielsweise der Fertigungsplanung und der Optimierung der Stromverteilung. Dieses Prüfverfahren ist für Messungen eines IC anwendbar, der auf einer Leiterplatte in Funktion angebracht ist, die für die Abtastsonde zugänglich ist.